:	Search Notes								

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/711,996	CHEN ET AL.	İ
Examiner	Art Unit	
VAN T. PHAM	2627	

	-:		
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	:		
	:		
	:		
	:		
	•		
	·		
	:		
i.	1:]	

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
		:			
:					
	Subclass	Subclass Date			

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH		
	DATE	EXMR
East (US-PGPUB; USPAT; USOCR;EPO;JPO;DERWENT;IBM_T DB) 369 and 369/53.31, 47. (text search only see search history printout).	2/14/2007	VP
	•	
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·